

# Advanced Semiconductor ICs Reliability

## Advanced Electronics + Data Science

**2 Maggio ore 9.30**

**Aula Magna Dipartimento di Ingegneria**

- 9.30**      **Saluto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria**  
Prof. Ermanno Cardelli
- 9.40**      **La Ricerca Scientifica in ELES**  
Ing. Francesca Zaffarami, *CEO ELES*
- 10.00**     **Collaboration Opportunities with the Fraunhofer ENAS Institute**  
Dr. Harald Kuhn, *Head of Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems ENAS*
- 10.20**     **Semiconductor ICs Reliability Test**  
Ing. Alessandro Maseri, *Application Development Mgr ELES*
- 10.40**     **Auto Diagnosi di Elettronica Integrata in Silicio per Applicazioni ad Alta Affidabilità**  
Prof. Federico Alimenti, *Dipartimento di Ingegneria*
- 11.00**     **Data Science e Artificial Intelligence per i Test di Alta Affidabilità**  
Prof. Gianluca Reali, *Dipartimento di Ingegneria.*
- 11.15**     **Chiusura dei Lavori**

**ELES – RETE (Reliability Embedded Test Engineering)**  
**THE FAST ROADMAP TO ZERO DEFECTS**